

**ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ  
МОЛЕКУЛЯРНОГО ДЕЙТЕРИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ  
С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИИ НЕЙТРОНОВ**

В.П.Глазков, С.П.Беседин, И.Н.Гончаренко,  
А.В.Иродова, И.Н.Макаренко, В.А.Соменков,  
С.М.Стишов, С.Ш.Шильштейн

Определены параметры элементарной ячейки молекулярного дейтерия при давлениях до 31 ГПа и комнатной температуре с использованием метода нейтронной дифракции и техники алмазных наковален.

Несмотря на значительный интерес к проблеме сильно сжатого водорода, неизменно сохраняющийся в течение многих лет, начиная с классической работы Вигнера и Хантингтона (1935 г.)<sup>1</sup>, экспериментальные достижения в этой области остаются достаточно скромными.

Начало реальных экспериментальных исследований сильно сжатого водорода в условиях статических давлений следует отнести к 1979 г., когда исследовательской группе Вашингтонской геофизической лаборатории удалось получить спектры комбинационного рассеяния света водорода и дейтерия при давлениях до  $\sim 0,7$  Мбар<sup>2</sup>. В дальнейшем эти исследования были продолжены при давлениях вплоть до  $\sim 1,5$  Мбар<sup>3</sup>. Однако переход водорода в металлическое состояние так и не был обнаружен. Теоретические оценки давления металлизации водорода заключены в весьма широких пределах<sup>4–9</sup>, причем основные проблемы здесь, по-видимому, связаны с трудностями расчета свойств молекулярной фазы. И хотя на этом пути имеется заметное продвижение (см.<sup>7, 8</sup> и особенно<sup>9</sup>), экспериментальные исследования термодинамических свойств, и в частности, уравнений состояния молекулярной фазы водорода и дейтерия представляются важным звеном на пути к полному пониманию ситуации.

Первые попытки исследования уравнения состояния водорода и дейтерия при сверхвысоких давлениях описаны в<sup>10</sup> (до 0,37 Мбар) и<sup>11</sup> (до 0,2 Мбар). Как оказалось, результаты этих исследований находятся в противоречии (см. по этому поводу также<sup>12</sup>), однако пределы возможных погрешностей методов<sup>10</sup> и<sup>11</sup> не дают возможности сделать адекватный выбор.

В настоящей статье сообщается о результатах исследования уравнения состояния молекулярного дейтерия<sup>1)</sup> при давлениях до 31 ГПа с использованием метода нейтронной дифракции и техники алмазных наковален.

Ранее в работах<sup>13, 14</sup> было показано, что алмазные наковальни в комбинации с многодетекторным низкофоновым дифрактометром "ДИСК" могут быть использованы для наблюдения нейтронной дифракции, несмотря на предельно малые размеры образцов. В настоящей работе в отличие от<sup>13, 14</sup> исследовалась дифракция на монокристаллических образцах, что при всех прочих равных условиях давало выигрыш в интенсивности рефлексов. Монокристаллы дейтерия выращивались непосредственно в рабочем объеме алмазной ячейки путем перекристаллизации отдельных монокристаллических зерен, возникающих в результате спонтанной кристаллизации дейтерия при комнатной температуре и давлении  $\approx 5,4$  ГПа.

Заполнение алмазных камер дейтерием производилось с помощью специального устройства под давлением  $\sim 0,25$  ГПа.

Все дифракционные эксперименты проводились при комнатной температуре на реакторе ИР-8, имевшем в рабочем режиме мощность 6 МВт.

<sup>1)</sup> Дейтерий имеет втрое большее сечение когерентного рассеяния нейtronов, чем водород.

В предварительных опытах по дифракции нейтронов на образцах большого объема (при давлениях  $\approx 6$  ГПа) выяснилось, что кристаллы дейтерия, образующиеся в алмазной камере, имеют вполне определенную ориентацию, при которой ось с ГПУ решетки параллельна оси наковальни. Естественно, что это обстоятельство облегчало поиск необходимых отражений. Длина волны нейтронов ( $\lambda = 1,9 \text{ \AA}$ ) выбрана из условия получения максимального числа отражений при заданной геометрии эксперимента. В итоге на образце объемом  $\sim 0,1 \text{ mm}^3$  удалось зарегистрировать семь монокристальных пиков (рис. 1), положение которых было определено с точностью не хуже  $\pm 0,05^\circ$ . Все отражения были проиндексированы в ГПУ решетке с параметрами  $a = (2,6274 \pm 0,0008) \text{ \AA}$ ,  $c = (4,2934 \pm 0,0020) \text{ \AA}$ ,  $a/c = 1,634 \pm 0,001$ ,  $V = 25,66 \text{ \AA}^3$ . Точность определения объема элементарной ячейки при этом составила  $\pm 0,1\%$ .

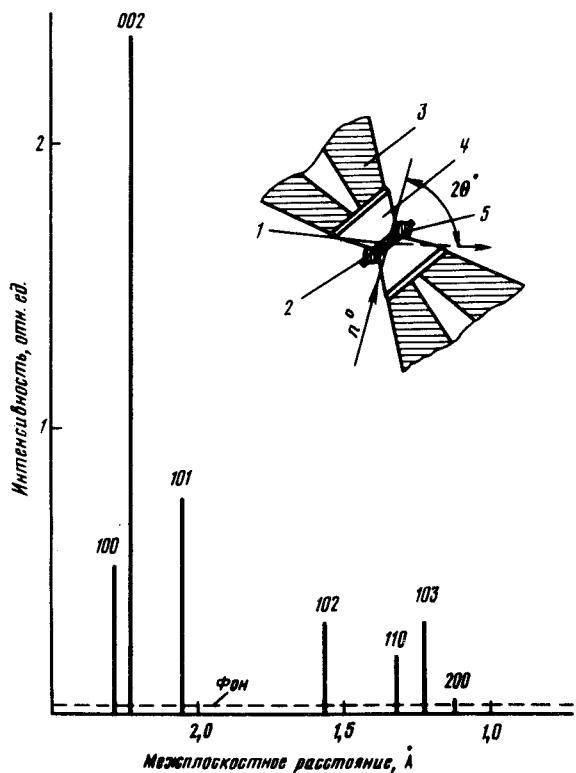


Рис. 1. Относительные интенсивности дифракционных максимумов монокристалла дейтерия в наковальнях при давлении в 6,17 ГПа; на вставке — схема эксперимента: 1 — образец, 2 — медная втулка, 3 — опора из твердого сплава, 4 — алмазные наковальни, 5 — прокладка из нержавеющей стали

В экспериментах при более высоких давлениях (с использованием образцов объемом  $\sim 10^{-2} \text{ mm}^3$ ) регистрировались всего лишь три отражения. Фрагменты соответствующих нейtronограмм представлены на рис. 2. Результирующая точность в определении параметров элементарной ячейки по этим данным составила:  $\delta a/a = \pm 0,1\%$ ;  $\delta c/c = \pm 0,1\%$  и  $\delta V/V = \pm 0,3\%$ .

Давление определялось с помощью "рубинового" манометра с использованием калибровочной зависимости<sup>15</sup>. С целью уменьшения влияния временного дрейфа ( $\sim 0,15 \text{ ГПа в сутки}$ ) на точность измерений давление в алмазных камерах определялось до и после регистрации каждого отражения. С учетом указанного источника ошибок суммарная погрешность определения давления составляла  $\pm 0,07 \div 0,1 \text{ ГПа}$ . В таблице и на рис. 3 представлены данные, характеризующие зависимость параметров решетки и молярного объема дейтерия от давления, рассчитанные на основе настоящих нейтронографических экспериментов. Прецизионная погрешность приведенных значений объема (с учетом ошибки в определении давления) составляет  $0,5 \div 0,7\%$ . Видно, что отношение  $c/a$  близко к идеальному значению для ГПУ решетки, и слабо зависит от давления.

$P$ , ГПа	6,17	15,5	16,5	18,5	20,5	25,5	30,9
$a$ , Å	2,6274	2,38	2,36	2,32	2,29	2,24	2,19
$c/a$	4,293	3,854	3,808	3,768	3,714	3,640	3,542
$V$ , см <sup>3</sup> /моль	7,729	5,69	5,55	5,31	5,11	4,72	4,43

Сравнение наших данных с результатами экспериментальных работ <sup>10, 11</sup> обнаруживает существенные различия, заметно превышающие пределы ошибок, объявленных авторами. При  $P > 10$  ГПа данные <sup>10</sup> ( $T = 5$  К) лежат значительно выше наших результатов. Очевидно, что учет теплового давления еще больше увеличивает эту разницу. Расхождение наших данных с результатами <sup>11</sup> менее значительно, хотя и составляет заметную величину ( $\sim 4\%$ ).

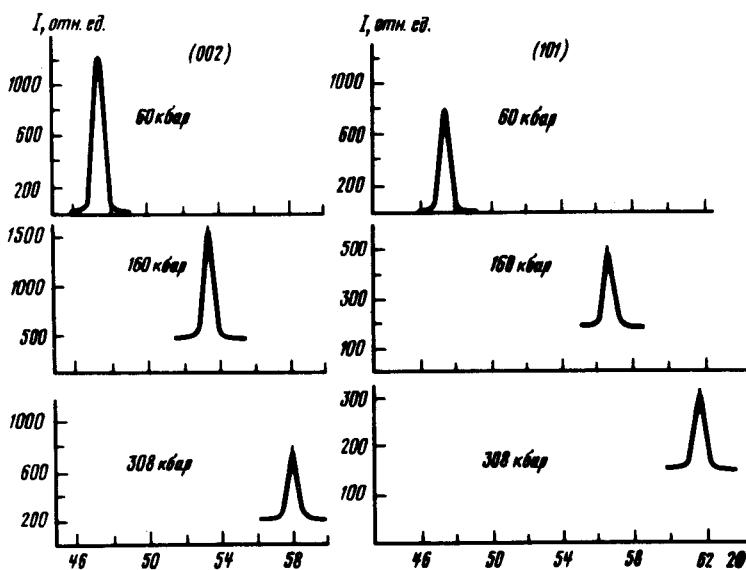


Рис. 2. Дифракционные максимумы монокристалла дейтерия при разных давлениях

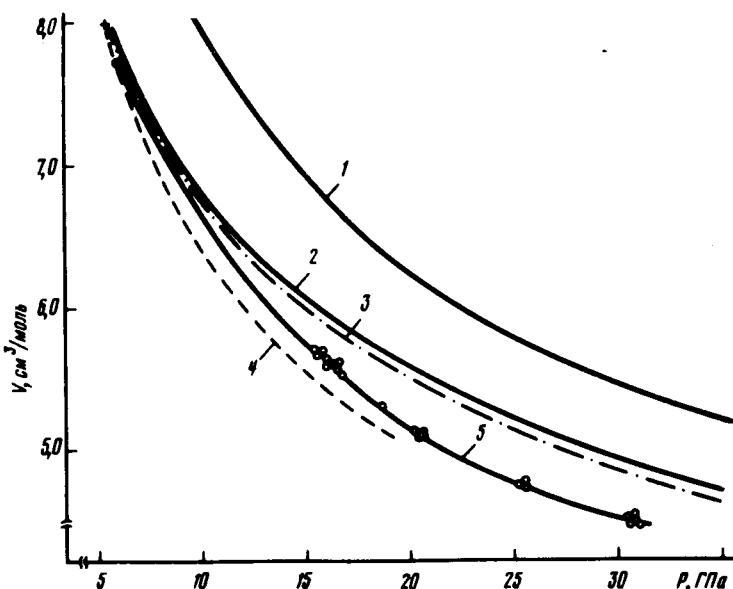


Рис. 3. Зависимость молярного объема дейтерия от давления: 1 – Ceperley, Alder (теория) <sup>9</sup>, 2 – Анисимов, Петров (теория) <sup>8</sup>, 3 – J. van Straaten et al. (эксп.) <sup>10</sup>, 4 – Shimizu et al. (эксп.) <sup>11</sup>, 5 – настоящая работа, + – Hazen et al. <sup>16</sup>

На рис. 3 приведены также результаты теоретических расчетов уравнения состояния молекулярной фазы водорода (изотопическим эффектом при сравнении можно пренебречь) <sup>10,11</sup>. В работах <sup>7,8</sup> проведен последовательный учет трехчастичных взаимодействий. Работа <sup>9</sup> представляет собой одно из первых применений квантового метода Монте-Карло к проблемам реального вещества. Как видно из рис. 3, согласие теоретических данных с экспериментами все же далеко от совершенства, так что пока нет оснований полагать, что оценки, даваемые теорией для давления металлизации водорода, являются реалистическими.

В заключение отметим, что недавно появилась работа <sup>16</sup>, содержащая сведения о параметрах элементарной ячейки водорода при давлении 5,4 ГПа, определенных методом дифракции рентгеновского излучения с помощью четырехкружного дифрактометра и алмазных наковален; результаты хорошо согласуются с нашими данными.

Авторы благодарят Б.К. Вайнштейна и Н.А. Черноплекова за поддержку работы, Ю.Н. Кагана и В.В. Пушкарева за полезные дискуссии, Ю.А. Булановского и Ю.О. Станкевича за помощь в проведении эксперимента.

### Литература

1. Wigner E., Huntington H.B. J. Chem. Phys., 1935, **3**, 764.
2. Sharma S.K., Mao H.K., Bell P.M. Phys. Rev. Lett., 1980, **44**, 886.
3. Mao H.K., Bell P.M., Hemley R.J. Phys. Rev. Lett., 1985, **55**, 99.
4. Абрикосов А.А., Астрономич. журнал, 1954, **31**, 112;
5. Каган Ю., Холас А., Пушкарев В.В. ЖЭТФ, 1977, **73**, 968.
6. Ross M. Rep. Prog. Phys., 1985, **48**, 1.
7. Анисимов С.И., Петров Ю.В. ЖЭТФ, 1978, **74**, 778.
8. Петров Ю.В. ЖЭТФ, 1983, **84**, 776.
9. Ceperley D.M., Alder B.J. Phys. Rev. B, 1987, **36**, 2092.
10. J. van Straaten, Wijngaarden R.J., Silvera I.F. Phys. Rev. Lett., 1982, **48**, 97.
11. Shimizu H., Brody E.M., Mao H.K., Bell P.M. Phys. Rev. Lett., 1981, **47**, 128.
12. Ross M., Ree F.H., Young D.A. J. Chem. Phys., 1983, **74**, 1487.
13. Шильштейн С.Ш., Глазков В.П., Макаренко И.Н. и др. ФТТ, 1983, **25**, 3309.
14. Glazkov V.P., Irodova A.V., Somenkov V.A. et al. J. Less-com. Met., 1987, **129**, 165.
15. Mao H.K., Bell P.M., Shaner J., Steinberg D. J. Appl. Phys., 1978, **49**, 3276.
16. Hazen R.M., Mao H.K., Finger L.W. Hemley R.J. Phys. Rev. Lett., 1987, **36**, 3944.

Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова

Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
27 апреля 1988 г.